

2^{as}

JORNADAS sobre gestión EMPRESARIAL de la INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS



MADRID

19 ENE. 2010

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

C/ Ribera del Loira 56 / 58 - 28042 Madrid

SALAS GOYA - VELÁZQUEZ Y MADRID

Organizan: **RTDI** y



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN



Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

COLABORAN



Eva García Muntión

evagarcia@rti.eu
www.rtdi.eu

Mozart 42 7°C
28008 Madrid (Spain)
+34 915 485 207

2as Jornadas de Innovación Empresarial: **VIGILAR PARA INNOVAR**

Madrid, 19 de Enero de 2010

Objetivos de taller

- Aclarar algunas ideas sobre qué es la Vigilancia Tecnológica.
- Demostrar todas las potenciales aplicaciones de la Vigilancia.
- Facilitar la implantación de procedimientos de Vigilancia en las empresas participantes.
- Explotar todas las fuentes posibles de Vigilancia.
- Potenciar la toma de decisiones basada sobre conocimiento adquirido a través de la Vigilancia.

Indice

Objetivos del taller

Vigilancia Tecnológica: ¿Qué es?

Vigilancia Tecnológica: ¿Para qué?

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i

Vigilancia Tecnológica: Proceso / Pasos

Selección de fuentes de información

Extracción y captación de información

Análisis y selección de información

Cerrando el ciclo

Vigilancia Tecnológica. ¿Qué es?

La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.

Definición según norma UNE 166006:2006 Ex Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica.

La vigilancia consiste en realizar de forma sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de información técnica útil para la supervivencia y el crecimiento de la empresa (Pere Escorsa)

Vigilancia Tecnológica. ¿Qué es?



Vigilancia Tecnológica. ¿Qué es?

- Las empresas europeas pierden 30.000 millones euros al año trabajando en innovaciones o invenciones que ya están patentados.
- Cada año se publican dos millones de artículos en revistas científico-técnicas, se registran un millón de temas, y se publican siete millones de nuevas webs.

La vigilancia consiste en realizar de forma sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de información técnica útil para la supervivencia y el crecimiento de la empresa (Pere Escorsa)

Vigilancia “tradicional” / Vigilancia “profesionalizada”

Indice

Objetivos del taller

Vigilancia Tecnológica: ¿Qué es?

Vigilancia Tecnológica: ¿Para qué?

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i

Vigilancia Tecnológica: Proceso / Pasos

Selección de fuentes de información

Extracción y captación de información

Análisis y selección de información

Cerrando el ciclo

Vigilancia Tecnológica. ¿Para qué? Objetivos empresariales de la VT

- Saber en qué tecnologías y en qué productos se está trabajando: En el área de su empresa, cuáles son las líneas de investigación, con qué se trabaja, en qué se investiga, qué se publica y qué se patenta; qué tecnologías emergen, crecen y cuáles quedan obsoletas.
- Quiénes son los líderes tecnológicos en su sector, de cada tecnología (persona física / entidad).



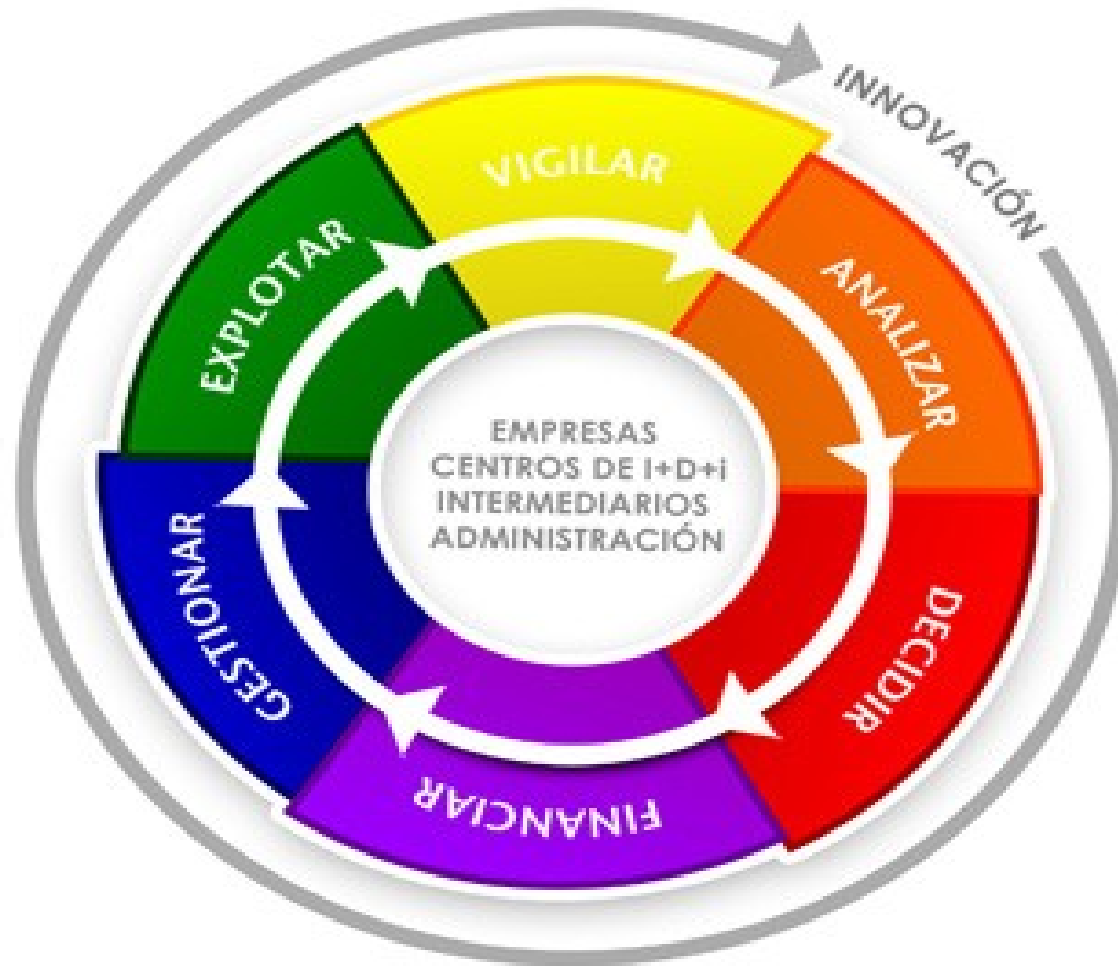
- Qué tecnologías pueden utilizarse para dar respuesta a nuevas demandas o potenciales demandas de sus mercados.
- **Cómo puedo explotar nuevos desarrollos tecnológicos**
- **Dónde están esas tecnologías.**

Vigilancia Tecnológica. ¿Para qué? Información adicional

- Vigilancia de normas
- Vigilancia de la competencia
- Vigilancia del mercado
- Vigilancia de nuevos productos
- Vigilancia de concursos públicos

**VIGILANCIA TECNOLÓGICA vs
INTELIGENCIA COMPETITIVA /
ECONÓMICA**

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i



Rueda de la Innovación de RTDI

Indice

Objetivos del taller

Vigilancia Tecnológica: ¿Qué es?

Vigilancia Tecnológica: ¿Para qué?

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i

Vigilancia Tecnológica: Proceso / Pasos

Selección de fuentes de información

Extracción y captación de información

Análisis y selección de información

Cerrando el ciclo

Vigilancia Tecnológica. Proceso / Pasos



Vigilancia Tecnológica.

Selección de fuentes de información

FASE 1

- Bases de datos de artículos científicos:
- Science citation index
- Chemical Abstracts (Industria Química)
- Compendex (Ingeniería)
- Inspec (electricidad / electrónica)
- IEEE (TIC)

- Bases de datos de patentes:
(otras formas de protección de la propiedad)

- Patentes españolas
- Patentes europeas
- Patentes EEUU
- Patentes Japón

FASE 2

- Páginas webs corporativas
- Otras (legislación y normativas, coyuntura socio-económica, información sobre ayudas y subvenciones)

**¿CUÁLES SON LAS
FUENTES DE
INFORMACIÓN
INTERNA?**

[artículo](#)[discusión](#)[editar](#)[historial](#)

Science Citation Index

Science Citation Index (SCI) es una **base de datos** documental donde se recogen todas las contribuciones (artículos, editoriales, cartas, revisiones, discusiones, etc.) que se puedan publicar a las revistas de ciencia y tecnología indizadas por **Thomson Scientific**. A este **índice de citación** también se le conoce como ISI ya que en un principio la institución que producía en índice era el **Instituto para la Información Científica**, Institute for Scientific Information (ISI), fundado por **Eugene Garfield** en 1960.

Debido al gran volumen de información científica y técnica que se produce en nuestros días, esta base de datos selecciona muy atentamente las revistas que indexa, siendo muy cuidadosa con los criterios de selección para mantener una alta calidad de la información indexada. Publicar en una revista indexada por el ISI es valorado de manera muy positiva en las políticas de evaluación científica.

Véase también [\[editar\]](#)

- Factor de impacto

Enlaces externos [\[editar\]](#)

- Science Citation Index [↗](#) (en inglés)
- ISI - Thomson Scientific [↗](#) (en inglés)



WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

Buscar

- Contribución
- Inicio
- Portada
 - Portal de la comunidad
 - Actualidad
 - Cambios recientes
 - Página aleatoria
 - Ayuda
 - Donaciones
 - Privacidad/Exportar

Engineering Village | ei.org - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://www.ei.org/engineering-village

Más visitados Comenzar a usar Firefox Últimas noticias Novedades del portal ...

Engineering Village | ei.org

E EngineeringInformation
Home of Engineering Village **125th ANNIVERSARY**


SEARCH

Home | RSS | Login to Engineering Village

ENGINEERING VILLAGE PRODUCTS SUPPORT & TRAINING WHO WE HELP ABOUT US CONTACT US

| Engineering Village | Ei History | Case Studies & White Papers | Ei Publications

>> Engineering Village

Take a product tour. 

Engineering Village is the information discovery platform of choice for the engineering community. In a single interface, researchers get access to today's most important engineering content. Engineering Village is the first place users go to find answers to questions from the abstract to the precise, from the basic to the complex. Powerful search tools plus an intuitive user interface boosts research productivity. Hyperlinked records and full-text links give researchers meaningful results through a more comprehensive view of the information.

Bring intelligence into the search.
Engineering Village's dynamic search environment gives researchers intelligence about their search results, helping them make sense of what they find and apply it to their work. [Find out how they are using EV.](#)

Find relevant, trustworthy engineering information.
Engineering Village links to multiple engineering literature databases from a range of trusted sources: Scholarly journals, trade publications, patents, government reports, reference books, conference proceedings and more.

Get up and running – fast.
Engineering Village is easy to learn and use. Intuitive interfaces guide users of all abilities through

Engineering Village Databases:

- Compendex & Ei Backfile
- Chimica & CBNB
- Ei Patents
- EnCompassLIT & PAT
- GEOBASE
- GeoRef
- PaperChem
- Referex
- Inspec & Inspec Archive
- NTIS

REQUEST A FREE TRIAL

↓ [Download the brochure](#)

[Comments or questions](#)

Terminado

What articles are your colleagues reading?

What is your competitor researching?

1 2 3

Find an article in the IEEE Xplore digital library

Search »

Sign in to view your IEEE Member information through myIEEE »

Forgot your web account username or password?

IEEE News	Inside IEEE	Product Highlights	What do you want to do?
<p>IEEE Expresses Condolences to Haiti</p> <p>IEEE is deeply saddened by the tragic loss of life and extensive damage in Haiti. We are concerned for the Haitian community worldwide and for our members in Haiti, and offer condolences to those who have lost loved ones and friends. To further relief efforts, IEEE encourages members, volunteers and staff to</p>	<p>Conferences, Meetings, and Events</p> <p>Locate upcoming conferences or find volunteer/corporate meetings and society, section & chapter activities in your local area. Learn More»</p> <p>Education</p> <p>Register for online learning programs like IEEE Expert Now and Education Partners. Or find other IEEE education activities</p>	<p>IEEE Power & Energy Library</p> <p>Authoritative information for innovative organizations Learn More» Organizational Trial»</p> <p>IEEE/IET Electronic Library</p> <p>The complete collection for corporations and institutions Learn More» Organizational Trial»</p>	<ul style="list-style-type: none">Renew membershipJoin IEEE or an IEEE SocietySet up IEEE Web accountLog in to My AccountFind an IEEE standardGet member e-mail aliasView IEEE.tvObtain member insuranceLocate a jobFind student resourcesTake a course

Vigilancia Tecnológica.

Selección de fuentes de información

FASE 1

- Bases de datos de artículos científicos:
- Science citation index
- Chemical Abstracts (Industria Química)
- Compendex (Ingeniería)
- Inspec (electricidad / electrónica)
- IEEE (TIC)

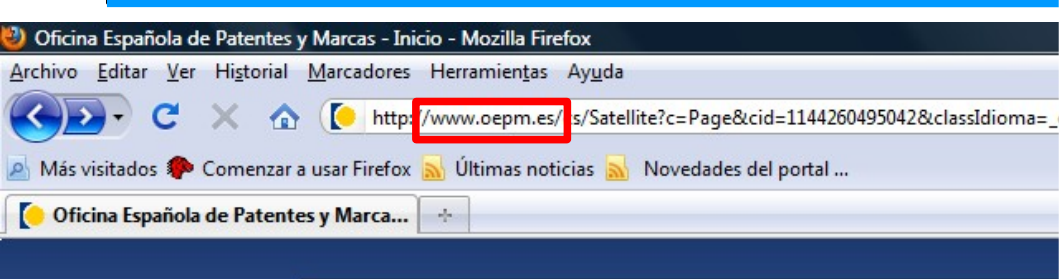
- Bases de datos de patentes:
(otras formas de protección de la propiedad)

- Patentes españolas
- Patentes europeas
- Patentes EEUU
- Patentes Japón

FASE 2

- Páginas webs corporativas
- Otras (legislación y normativas, coyuntura socio-económica, información sobre ayudas y subvenciones)

**¿CUÁLES SON LAS
FUENTES DE
INFORMACIÓN
INTERNA?**



- Información general y normativa
- Bases de datos
- Boltines de VT
- Boletín oficial de la propiedad industrial



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO



Oficina Española de Patentes y Marcas

B.O.P.I.	Conócenos	Propiedad Industrial	Modalidades	Oficina Virtual
<p>Oficina Virtual</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pago telemático ▶ Solicitud de marca o nombre comercial ▶ Solicitud de renovación de marca o nombre comercial individual o por lotes ▶ Solicitud-e de invenciones ▶ Presentación de Recursos ▶ Ver más 			<ul style="list-style-type: none"> ▶ Marcas ▶ Nombres comerciales ▶ Patentes ▶ Modelo de utilidad ▶ Diseños industriales ▶ Topografías de productos semiconductores 	

Portales OEPM

- Información Tecnológica
- Calidad
- Piratería
- Archivo Histórico y Museo
- Acceso CCRR
- CEVIPYME

Agenda OEPM

Destacamos

- ▶ Plan E
- ▶ La Administración Electrónica en la OEPM
- ▶ Curso verano, Universidad Menéndez Pelayo

Noticias

Premios al inventor europeo del año 2010

Enero-Mayo 2010: Máster en Propiedad Industrial e Intelectual. Segundo curso: ...

Cortes de servicio de la ventanilla electrónica el día 19/01/2010

Corte de servicio del circuito de Internet el 19/01/2010 a las 8:00

[▶ Ver más noticias](#)

Bases de datos

- ▶ Localizador de marcas
- ▶ Situación de expedientes
- ▶ Invenciones y Diseños en español: INVENES
- ▶ Invenciones en otros idiomas: esp@cenet
- ▶ Invenciones Latinoamericanas: Latipat
- ▶ Clasificación Internacional de Patentes
- ▶ Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Marcas)

Formularios

Tasas 2010

Servicios de Información Tecnológica

- ▶ Informes Tecnológicos de Patentes
- ▶ Informes de Vigilancia Tecnológica a medida
- ▶ Búsquedas retrospectivas
- ▶ Boletines de Vigilancia Tecnológica

- VT a medida
- Informes tecnológicos de patentes (alrededor de 500 Eu en 3 semanas) (listado de referencias y documentos relevantes)
- Búsquedas retrospectivas (entre 20 y 100 Eu / 1-3 días)

esp@cenet — Home page - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://ep.espacenet.com/

Más visitados Comenzar a usar Firefox Últimas noticias Novedades del portal ...

Oficina Española de Patentes y Mar... esp@cenet — Home page

European Patent Office

Home | Contact English Deutsch Français Help index ?

esp@cenet - NEWS,

esp@cenetユーザーの皆様、
esp@cenet assistant 日本語版 (36本の短編eラーニングモジュールを通じてesp@cenetの使い方が学べます)

SmartSearch [BETA]:

Example: Siemens EP 2007
Explanation: Smart Search will look for Siemens as being the inventor/applicant (first letter in uppercase), for all EP, i.e., European patent applications (2 letters in uppercase for the country code) and 2007 as publication date (4 digits for the year of publication).

Merry Christmas and Happy New Year from the esp@cenet team, we'll be back in 2010 with more news and information

News from the world of esp@cenet

News from France

At the beginning of October 2009, INPI (Institut national de la propriété industrielle) launched its new Patent Status Database.
You can access it via:
<http://www.inpi.fr>, Base Statut des brevets
or
<http://patent-status.inpi.fr>
[Read more](#)

News Flashes

Scheduled maintenance
Please be advised that espacenet may have short outages on the 18th around 17:00CET, 19th around 08:00CET and again on the 24th of January
[read more...](#)

Newsflash
Newsflash 1/2010 The EPO has regrettably not been able to update French bibliographic data since week 2009/46. The experts are working hard to try and resolve this problem. You will be informed in a future Newsflash, when the re-loading of FR front-file data commences. We apologise for any inconvenience caused due to this delay.
[read more...](#)

Latest Updates

Terminado

- 45 millones de documentos:
- EP, US, DE, GB, FR, CH, WO, JP, NL, BE, DK, SE desde 1920
- JP desde 1976
- Resto hasta 60 países desde 1968

PatFT » Page 1 of 1 - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Japan Patent Office - Mozilla Firefox

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

http://www.jpo.go.jp/quick_e/index_search.htm

Japan Patents Database

Más visitados Comenzar a usar Firefox Últimas noticias Novedades del portal ...

Japan Patent Office

Quick Guide

Japan Patent Office

Patent law and Utility model law / Design law / Trademark law / **Search Industrial property database**

[HOME](#) > [Quick Guide](#) >

■ Search Industrial property database

- Searching for patent/utility model rights for new invention ▶ [Reference Room\[Industrial Property Digital Library\(IPDL\)\]](#)
- Searching for design rights ▶ [Reference Room\[Industrial Property Digital Library\(IPDL\)\]](#)
- Searching for trademark rights ▶ [Reference Room\[Industrial Property Digital Library\(IPDL\)\]](#)

▲ Page Top

[HOME](#) > [Quick Guide](#) >

HOME National Center for Industrial Property Information and Training (INPIT) — Industrial Property Digital Library (IPDL) Related Web Sites

(C)Copyright:2007 Japan Patent Office

Terminado

Indice

Objetivos del taller

Vigilancia Tecnológica: ¿Qué es?

Vigilancia Tecnológica: ¿Para qué?

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i

Vigilancia Tecnológica: Proceso / Pasos

Selección de fuentes de información

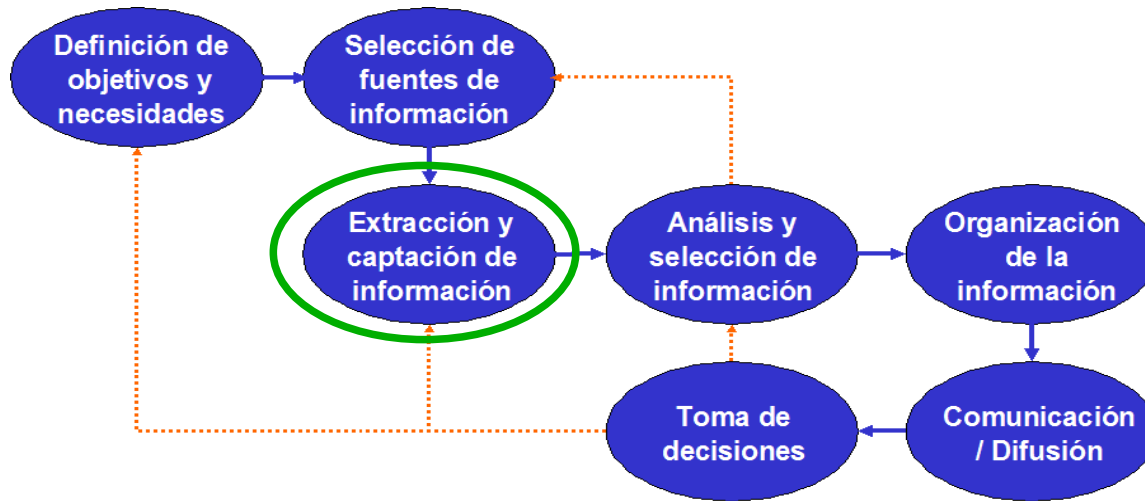
Extracción y captación de información

Análisis y selección de información

Cerrando el ciclo

Vigilancia Tecnológica.

Extracción y captación de información



- Metabuscadores
- Agentes *pull*
- Captación ideas internas

artículo

discusión

editar

historial

Metabuscador

El **metabuscador** es un sistema que localiza información en los motores de búsqueda más usados y carece de base de datos propia y, en su lugar, usa las de otros buscadores y muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada buscador. Un buscador normal recopila la información de las páginas mediante su indexación, como **Google** o bien mantiene un amplio directorio temático, como **Yahoo**. La definición simplista sería que un metabuscador es un buscador de buscadores.

Hoy en día existen diversos metabuscadores como **kartoo**, **metacrawler**, **todalanet**, **ipselon**, **turbo10**, **webcrawler**, **dogpile**, **cluppy** entre otros los metabuscadores facilitan y hacen más eficiente la búsqueda de información.

Ventajas [editar]

La ventaja principal de los metabuscadores es que amplían de forma notoria el ámbito de las búsquedas que realizamos, proporcionando mayor cantidad de resultados. La forma de combinar los resultados depende del metabuscador empleado.

Puesto que muchos **multibuscadores** muestran en los resultados la posición de la **web** en los buscadores nos permite evaluar la relevancia de cada **web** mostrada.

Hay que tener en cuenta que cada **buscador** utiliza su propia estrategia a la hora recoger **información** de una página y ordenar los resultados de las búsquedas, por lo que las páginas de mayor relevancia en un buscador no tienen por qué coincidir con las del resto, aportando puntos de vista distintos.

Desventajas [editar]

Una de las desventajas importantes es que mientras que cada buscador dispone de su propia sintaxis de búsqueda los metabuscadores no distinguen entre las diferentes sintaxis. Por lo tanto, al buscar información muy específica es mejor emplear buscadores de los que conozcamos la sintaxis.

Es de notar que no resultan muy claros los criterios empleados por los diversos multibuscadores para la ordenación de sus resultados.

Al buscar en varias fuentes, la obtención de resultados suele ser más lenta que en un buscador normal. Muchos de los multibuscadores permiten establecer un tiempo máximo para realizar la búsqueda.

Categoría: Motores de búsqueda de Internet

- <http://www.xaarky.es/>
- <http://www.kartoo.com/>
- <http://searchenginewatch.com/2156241>



WIKIPEDIA
La enciclopedia libre

buscar

navegación

- Portada
- Portal de la comunidad
- Actualidad
- Cambios recientes
- Página aleatoria
- Ayuda
- Donaciones

imprimir/exportar

- Crear un libro
- Descargar como PDF
- Versión para imprimir

herramientas

- Lo que enlaza aquí
- Cambios en enlazadas
- Categorias

Indice

Objetivos del taller

Vigilancia Tecnológica: ¿Qué es?

Vigilancia Tecnológica: ¿Para qué?

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i

Vigilancia Tecnológica: Proceso / Pasos

Selección de fuentes de información

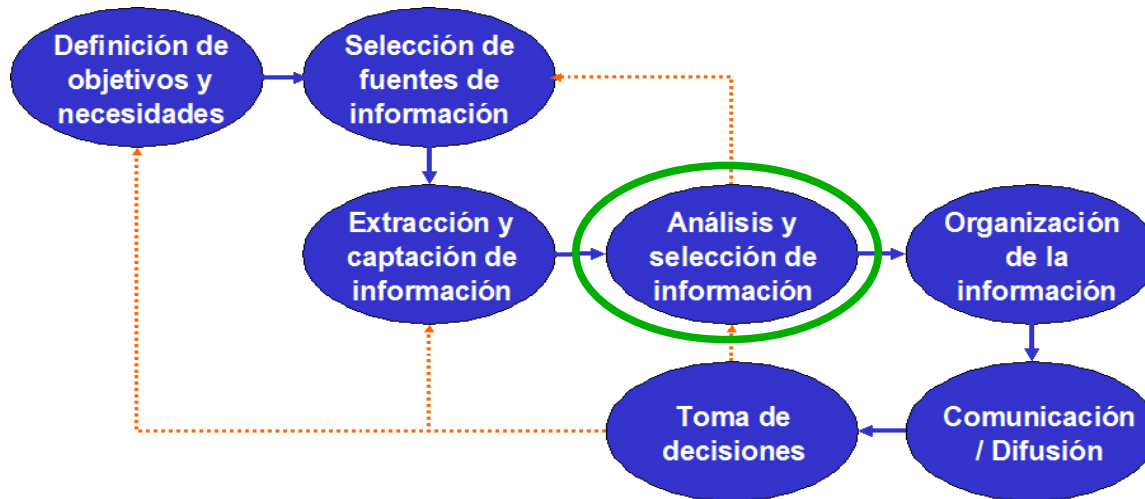
Extracción y captación de información

Análisis y selección de información

Cerrando el ciclo

Vigilancia Tecnológica.

Análisis y selección de información



- Registros principales: identificación, localización, selección, creación de una población (1000-1500) (título, autor / entidad, año, resumen / abstract, **descriptores e identificadores**, idioma, códigos de clasificación)
- Análisis: Contar palabras / análisis de tendencias, concurrencia de palabras / mapas tecnológicos.

KNEE-PROTECTING AIRBAG APPARATUS

Bibliographic data	Description	Claims	Mosaics	Original document	INPADOC legal status
<p>Publication number: US2010007120 (A1)</p> <p>Publication date: 2010-01-14</p> <p>Inventor(s): ADACHI YUICHI [JP]; BITO KAZUAKI [JP]; FUKAWATASE OSAMU [JP]; SANADA AKIYOSHI [JP] +</p> <p>Applicant(s): TOYOTA MOTOR CO LTD [JP] +</p> <p>Classification:</p> <ul style="list-style-type: none"> - international: B60R21/16; B60R21/16 Código CIP (IPC) - European: B60R21/203; B60R21/237 <p>Application number: US20080312771 20080109</p> <p>Priority number(s): JP20070006212 20070115; WO2008JP50470 20080109</p> <p>View INPADOC patent family</p> <p>View list of citing documents</p>	<p>Also published as:</p> <ul style="list-style-type: none"> WO2008087993 (A1) KR20090091224 (A) JP2008168868 (A) EP2125448 (A1) CN101568449 (A) <p>Familia de patentes</p> <p>Report a data error here</p>				
<p>Abstract of US 2010007120 (A1)</p> <p>Translate this text</p>					

Otros documentos relacionados con una patente:

- Patentes de la misma familia (y sus informes)
- Patentes que cita
- Citas en el informe del estado de la técnica
- Patentes que la citan



Search the European classification

Find classification(s) for keywords

syringe injection

Search

Go

Index [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [Y](#)

Next: [A](#)

HUMAN NECESSITIES	A <input type="checkbox"/>
PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING	B <input type="checkbox"/>
CHEMISTRY; METALLURGY	C <input type="checkbox"/>
TEXTILES; PAPER	D <input type="checkbox"/>
FIXED CONSTRUCTIONS	E <input type="checkbox"/>
MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING ENGINES OR PUMPS	F <input type="checkbox"/>
PHYSICS	G <input type="checkbox"/>
ELECTRICITY	H <input type="checkbox"/>
GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS[N0403]	Y <input type="checkbox"/>

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau(43) International Publication Date
24 July 2008 (24.07.2008)

PCT

(10) International Publication Number
WO 2008/087993 A1

(51) International Patent Classification:

B60R 21/237 (2006.01) **B60R 21/203** (2006.01)

(21) International Application Number:

PCT/JP2008/050470

(22) International Filing Date: 9 January 2008 (09.01.2008)

(25) Filing Language:

English

(26) Publication Language:

English

(30) Priority Data:

2007-006212 15 January 2007 (15.01.2007) JP

(71) Applicant (for all designated States except AU, BR, CA, IN, KR, MY, PH, RU, US, VN): **TOYODA GOSEI CO., LTD.** [JP/JP]; 1, Aza Nagahata, Oaza Ochiai, Haruhi-cho, Nishikasugai-gun, Aichi, 4528564 (JP).(71) Applicant (for all designated States except US): **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA** [JP/JP]; 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 4718571 (JP).

(72) Inventors; and

(75) Inventors/Applicants (for US only): **ADACHI, Yuichi** [JP/JP]; c/o TOYODA GOSEI CO., LTD., 1, Aza Nagahata, OazaOchiai, Haruhi-cho, Nishikasugai-gun, Aichi, 4528564 (JP). **BITO, Kazuaki** [JP/JP]; c/o TOYODA GOSEI CO., LTD., 1, Aza Nagahata, OazaOchiai, Haruhi-cho, Nishikasugai-gun, Aichi, 4528564 (JP). **FUKAWATASE,****Osamu** [JP/JP]; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 4718571 (JP). **SANADA, Akiyoshi** [JP/JP]; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi, 4718571 (JP).(74) Agents: **IIDA, Akio** et al.; 11-26, Marunouchi 2-chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi, 4600002 (JP).

(81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Published:

— with international search report

(54) Title: KNEE-PROTECTING AIRBAG APPARATUS

Vigilancia Tecnológica. Análisis y selección de información

Análisis de tendencias:

- Aparición de nuevas palabras clave / desaparición tecnologías obsoletas.
- Cambios de liderazgo.
- Cambio de aplicación – análisis de los CIP

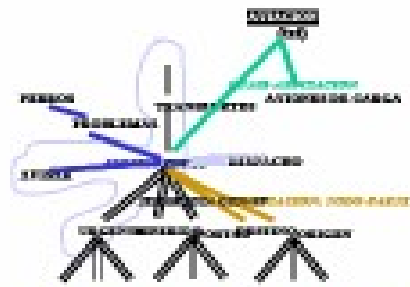
Identificación hitos

Discusión técnica interna

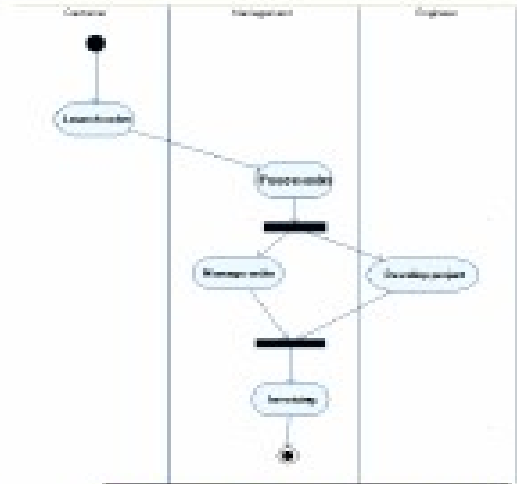
Vigilancia Tecnológica. Análisis y selección de información

- Concurrencia de palabras (análisis *coword*). Aparición de nuevas combinaciones (localización / registro) / desaparición tecnologías obsoletas.
- Concurrencia autor vs entidad; autor o entidad vs IPC, de IPCs, de palabras e IPCs.
- Mapas tecnológicos, mapas de competencia
- Datamining

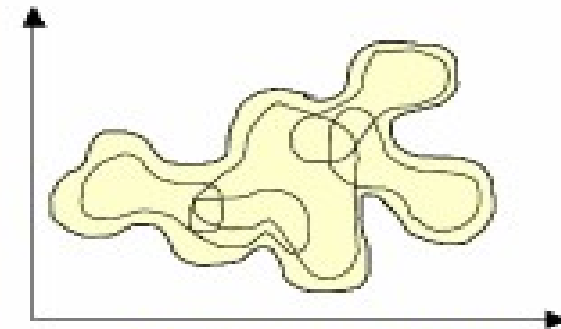
Identificación hitos
Discusión técnica interna



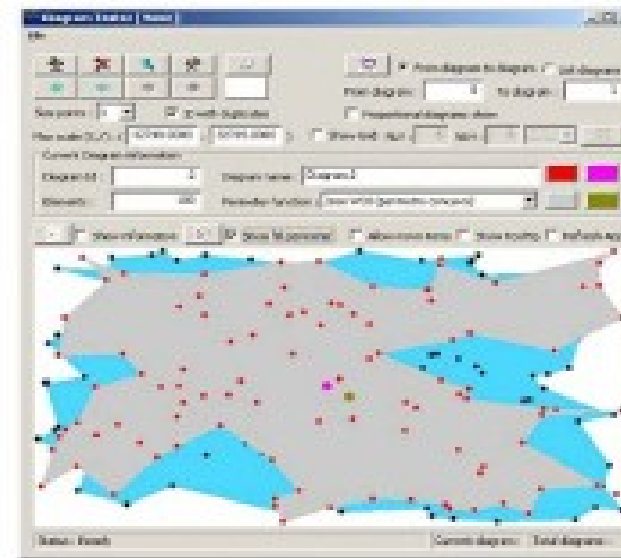
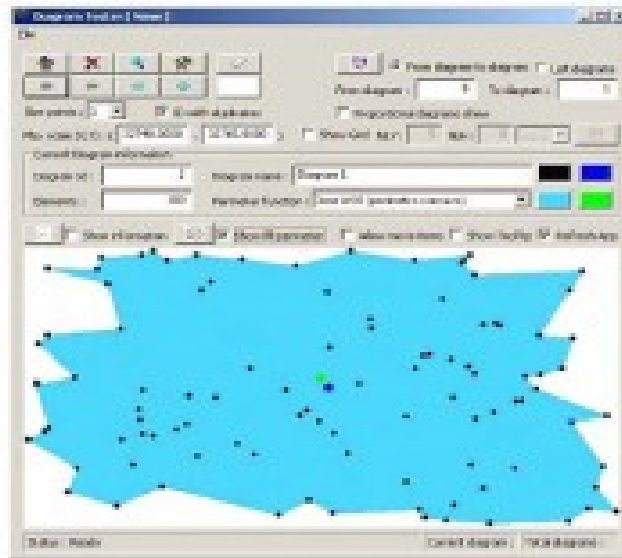
Structural visualization



Dynamical / Processes



Domain visualization



Examples of graphical knowledge maps and knowledge maps comparison for knowledge application and reuse.

Indice

Objetivos del taller

Vigilancia Tecnológica: ¿Qué es?

Vigilancia Tecnológica: ¿Para qué?

Vigilancia Tecnológica en la gestión corporativa de la I+D+i

Vigilancia Tecnológica: Proceso / Pasos

Selección de fuentes de información

Extracción y captación de información

Análisis y selección de información

Cerrando el ciclo

Vigilancia Tecnológica. Cerrando el ciclo



EJERCICIO

TOMAR ALGUNA DECISIÓN EN RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE I+D+i DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN DISPOSITIVOS MÓVILES PARA EL SECTOR TURISMO

GRUPOS:

- ✓ GRUPO 1 – Herramientas: buscadores / metabuscadores.
- ✓ GRUPO 2 – Herramientas: bases de datos de patentes.
- ✓ GRUPO 3 – Herramienta: herramienta corporativa de vigilancia.
- ✓ GRUPO 4 – Herramienta: datamining.
- ✓ GRUPO 5: Sin limitaciones.

FACTOR ADICIONAL:

- ✓ Tiempo: 30 minutos

2^{as} JORNADAS sobre gestión EMPRESARIAL de la INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICAS



MADRID
19 ENE. 2010

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID
C/ Ribera del Loira 56 / 58 - 28042 Madrid
SALAS GOYA - VELÁZQUEZ Y MADRID

Organizan: **RTDI** y



**¡MUCHAS
GRACIAS!**

evagarcia@rti.eu
91 5485459

RTDI